

適用規格																										
定 格	使用温度範囲	-45℃～ + 125℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～ + 60℃（注2）																						
	電 圧	AC 50 V	適合コネクタ	DF12#-*DS-0.5V(**)																						
	電 流	0.3 A																								
性 能																										
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT																					
構造	外観、構造、仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○																					
	表示	目視にて確認する。		○	○																					
電氣的性能	接触抵抗	100 mA(DC又は 1000 Hz)で測定する。	50 mΩ以下	○	—																					
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ以上	○	—																					
機械的性能	耐電圧	AC 150 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—																					
	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	<table><tr><td>極数</td><td>挿入力 (N)以下</td><td>抜去力 (N)以上</td></tr><tr><td>20</td><td>23.4</td><td>2.6</td></tr><tr><td>30</td><td>27.0</td><td>3.4</td></tr><tr><td>36</td><td>29.0</td><td>4.0</td></tr><tr><td>40</td><td>30.6</td><td>4.2</td></tr><tr><td>50</td><td>34.2</td><td>5.0</td></tr><tr><td>60</td><td>38.0</td><td>6.0</td></tr></table>	極数	挿入力 (N)以下	抜去力 (N)以上	20	23.4	2.6	30	27.0	3.4	36	29.0	4.0	40	30.6	4.2	50	34.2	5.0	60	38.0	6.0	○	—
	極数	挿入力 (N)以下	抜去力 (N)以上																							
	20	23.4	2.6																							
	30	27.0	3.4																							
	36	29.0	4.0																							
	40	30.6	4.2																							
	50	34.2	5.0																							
	60	38.0	6.0																							
	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗：50 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—																					
耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—																						
耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—																						
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗： 50 mΩ以下 ②絶縁抵抗： 500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—																					
	温度サイクル	温度 -65 → 15～35 → 125 → 15～35℃ 時間 30 → 10～15 → 30 → 10～15分 を 5 サイクル 試験する。	①接触抵抗： 50 mΩ以下 ②絶縁抵抗： 500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—																					
	半田耐熱性	【 リフロー半田付けの場合 】 《 リフロー部 》 MAX 250℃ピーク 220℃以上 60 秒 以内 《 予熱部 》 150～180℃ 90～120 秒 リフローは同条件にて2回まで可能 【 手半田（リペア）の場合 】 半田ごてで 350℃、3秒の条件にて半田付け を行う。但し、端子に力を加えないこと。	外観の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。	○	—																					
	二酸化硫黄	濃度10ppm、96時間放置する。 (試験規格： J E I D A - 3 9)	①接触抵抗： 50 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。	○	—																					
	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水、48 時間放置する。	①接触抵抗： 50 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。	○	—																					
備考																										
(注1) 通電時の温度上昇を含みます。																										
(注2) 保存とは基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表し、基板搭載後の無通電状態は、使用温度範囲が適用 されます。エンボス梱包仕様時の保存温度範囲には-10～+50℃となります。																										
試験規格の記載のない試験方法は J I S C 5 4 0 2 を適用している。																										
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日																					
△																										
			承認	MO.NAKAMURA	05.04.06																					
			検 図	TS.MIYAZAKI	05.04.05																					
			担 当	YH.MICHIDA	05.04.04																					
			製 図	YH.MICHIDA	05.04.04																					
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC4-163510-07																							
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DF12B(3.5)-*DP-0.5V(86)																						
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL537	△ 1/1																					